



# ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΗΝΑ**  
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE  
**VEECO**  
**Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008**

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 και ώρα 08:30 στην αίθουσα Σεμιναρίων της Εταιρείας μας, οδός Τζαβέλλα 9, Κ. Χαλάνδρι για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM)** & **Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM)**.

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler. Θα υπάρχει εγκατεστημένο όργανο AFM (Model Innova), το οποίο θα επιδειχθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. [Υπάρχει επίσης δυνατότητα λεπτομερέστερης επίδειξης του οργάνου την Τρίτη 1/4/08 κατόπιν συνεννοήσεως].

08.30-09.00 *Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά*

09:00-09:05 Welcome to the Seminar

Δ. Σταμέλος

09:05-09:15 Veeco Introduction

Dr. H. Stadler

09:15-10:15 Scanning Probe Microscopy  
New Trends & Developments

Dr. H. Stadler

10:15-10.30 *Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά*

10:30-11:45 SPM/AFM Applications Materials, Polymers and  
Biological samples

Dr. H. Stadler

11:45-12:00 Questions

12:00-12:30 *Ελαφρύ γεύμα*

12:30-13:00 Innova – Versatile SPM System for research

Dr. H. Stadler

13:00:16:00 Workshop with Innova

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210-6748973 (εσωτ. 810) ή fax 210-6748978, ή e-mail rgeorgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος  
Χημικός  
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco

[Διαγωνίως απέναντι, οδός Τζαβέλλα 11, υπάρχει δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης]